

ランチョンセミナー B会場
日時:2019年11月29日(金) 11:50~12:50

新機能を搭載した JEM-1400Flash による広視野観察

日本電子株式会社 EM 事業ユニット

濱元千絵子



一般に生物試料の一次観察では生きたままの試料を
広視野にわたって観察でき、かつ各部の機能を反映
した染色が可能である光学顕微鏡(LM)が使われま
す。一方、電子顕微鏡(EM)は像の精細度や分解能に
おいて優れており、両方の手法を使って試料中の同
じ視野を観察する[Correlative Light and Electron
Microscopy(CLEM)法]の要求が増大しています。今回
はその手法と応用を紹介します。

環境セル型試料ホルダーを用いたその場観察実験

日本電子株式会社 EM 事業ユニット

大西市朗



近年、実環境下での観察・分析のニーズが高まっ
ています。これまでは特別な改造を施した専用の透過
型電子顕微鏡が必要でしたが、技術の革新が進み一
般的な透過型電子顕微鏡と環境セル型試料ホルダー
を組み合わせることでその場観察・分析が可能になりま
したので応用例を用いて紹介します。